

## FE 式走査型電子顕微鏡

電子線を用いて測定対象物を拡大し、数mm～ナノレベルの形状を観察できる装置

### 【型式】

日本電子（株） JSM-7200F

### 【仕様】

倍率 :  $\times 10 \sim \times 1,000,000$

加速電圧 : 0.01~30 kV

最大試料寸法 :  $\phi 100 \text{ mm} \times 40 \text{ mm}$  (t) 以内

分析可能元素 :  ${}_{4}\text{Be} \sim {}_{92}\text{U}$

検出器 : UED、LED、RBED (2次電子像、反射電子像、合成像)

その他機能 : GB 機能、Through The Lens 機能、長焦点深度機能、自動フォーカス、  
自動非点収差調整、自動色調調整

### 【設置年度】

2018 年度 (平成 30 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html> でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日